



## 사전 분석: 업계 고해상도 혁신

모든 빔 전파 알고리즘에 적합한 입력 값을 결정하는 것은 어려울 수 있습니다. DPS의 기반으로 분석 설정을 자동으로 추천하고 최단 시간에 정확한 답변을 제공합니다.

사전 분석 기능은 렌즈 기반...

사전 분석 기능은 프로브 빔릿의 하위 세트를 사용하여 시스템을 빠르게 스캔하고 다음을 포함한 수 입력에 대한 권장 값을 제공합니다:

- 입력 필드 샘플링
- 면 재생...
- 면 클립 검사
- 출력 그리드 위치, 크기 및 샘플링

사전 분석은 또한 권장 값을 기반으로 분석 실행 시간을 예측합니다



그림 4: Beamlet 풋프린트 플롯

- 빔렛 풋프린트 플롯 (위 그림에 표시됨)
- 단면 슬라이스 플롯
- 래스터 플롯
- 리소그래피 플롯
- 경사 투영 플롯
- 가우시안 빔 테이블

빔렛 세트를 렌즈 시스템의 모든 위치에 저장하고 다음 섹션의 후속 실행을 위한 입력값으로 사용할 수 있습니다. 이를 통해 시스템 섹션을 분석하고 계산 효율성을 높일 수 있습니다.

## Advanced Propagation 제어 기능

제품을 능숙하게 사용하기 위해 고급 사용자를 위해 BSP는 전파 프로세스, 임계값 및 매개변수에 대한 높은 수준의 제어 기능을 제공합니다. 다음을 위한 제어 기능이 제공됩니다.

- P
- Treatment Variation Checking
- Clip Checking Fidelity
- Computational Accuracy

## 다양한 응용 분야 전용 가능

비점 빔, 편광 광학 필드 입력, 낮은 f-수(예: 마이크로리소그래피 렌즈) 또는 비연속 pupil이 있는 BSP로 정확하게 분석됩니다. 이 기능은 near-field 회절 분석 및 회절격자, 유한면은 공간 필터와 초점 근처에서 집속 또는 위상이 수정되는 광학 시스템에 유용합니다. BSP는 파장 및 편광을

CODE V에 대한 자세한 내용은 <https://www.synopsys.com/optical-solutions.html>를 [optics@synopsys.com](mailto:optics@synopsys.com)으로 이메일을 보내십시오.